高強度遠赤外コヒーレント放射光源による吸収分光

高仲 信^{1,A)}、奥田修一^{A)}、加藤龍好^{A)}、高橋俊晴^{B)}、S.Nam^{C)}
 ^{A)} 大阪大学産業科学研究所

〒567-0047 大阪府美穂が丘 8-1

^{B)} 京都大学原子炉実験所

〒590-0494 大阪府泉南郡熊取町野田

^{C)} Department of Physics, Kangowon National University

Chunchon, 200-701, Korea

概要

我々は、阪大産研 38MeV Lバンド電子ライナック からのマルチバンチビームの条件を最適化し、コヒ ーレント遷移放射を利用した光源による液体の吸収 分光測定を行い、光の透過率から屈折率、消衰係数 を求めた。また、銀杏の葉などを試料として用い、 サブミリ・ミリ波領域での透過光によるイメージン グを試みた。

1. はじめに

高エネルギー電子バンチからのコヒーレント放射 は高強度であり、ミリ波・サブミリ波領域で連続ス ペクトルをもつ光源としての利用が期待され、その 基礎研究も行われている^[1,2]。コヒーレント放射は、 分光器を用いて波長を選択することができ、また高 強度であるため、吸収の比較的大きい物質に対して も透過率の測定が可能である。阪大産研では、38 MeV Lバンド電子ライナック^[3]からのマルチバンチビー ムの条件を最適化し、コヒーレント遷移放射を利用 した光源を確立した。遠赤外領域の光の水による吸 収はきわめて大きい。我々は水などの液体の吸収分 光測定を開始した。また、液体での分子間の衝突や 振動による光の吸収は、ミリ波・サブミリ波領域にあ るため、このような現象について新しい知見が得ら れるであろう。

2. コヒーレント放射の原理と特徴

遷移放射、シンクロトロン放射のように連続スペ クトルを持つ放射過程において、電子バンチからの 放射強度は、次式のように与えられる。

$$P(\lambda) = p(\lambda) N[1 + Nf(\lambda)]$$
(1)

 $p(\lambda): 1$ 電子からのインコヒーレントな放射の強度 N: バンチ内の電子の個数

λ : 放射の波長

ここで、*f*(*λ*)はバンチ形状因子と呼ばれ、次に示すようにバンチ内の電子の分布関数であらわされる。

(1)式よりバンチ形状因子が1に近いと、すなわち 波長がバンチ長より十分大きいと、放射の強度はバ ンチ内の電子数の二乗に比例する。このコヒーレン ト放射は、ライナックによって加速された電子バン チの長さと同程度、あるいはそれ以上の長波長領域 では、極めて高強度である。

今回の実験では、金属の境界面を荷電粒子が通過 するときに生じる遷移放射を利用した。放射過程に 遷移放射を利用する利点として、シンクロトロン放 射のように電磁石で電子ビームの軌道を変化させる 必要がないため、直進のビームを利用でき放射のス ペクトルが比較的安定である点があげられる。コヒ ーレント放射の特徴としては高強度であること、ミ リ波・サブミリ波領域で連続スペクトルを持つこと、 短パルスであること、通常のインコヒーレントな放 射と同様の偏光をもつという点があげられる。また、 パルスレーザーと光伝導スイッチを用いたテラへル ツ波の放射強度^[4,5]と比べても、コヒーレント放射は 高強度であるため、従来は不可能であったミリ波・ サブミリ波領域での物質の励起などが行える可能性 がある。

3. 実験条件

3.1 電子ビーム及び吸収分光測定系の条件

吸収分光測定で用いた産研ライナック(周波数: 1300MHz)のビーム条件は、ビームモード:マルチ バンチビーム、エネルギー:20-27 MeV、パルス幅:8 ns -15 μs、パルスの繰り返し:10 ppsである。最も 放射強度が安定するように、加速器のバンチャーと 加速管のマイクロ波の条件を変化させた。安定な光 を得るために、バンチ間隔 770 psのマルチバンチビ ームを利用した。光源に比較的安定なコヒーレント 遷移放射を用いた。

 $f(x) = \left| \int S(x) \exp i \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) dx \right|^2$ (2)

¹ E-mail : takana03@sanken.osaka-u.ac.jp

測定の実験配置を図1に示す。金属板から後方に 放射されるコヒーレント遷移放射を光源として利用 した。従来用いてきた金属板を SUS から AI に交換し ビームの散乱を抑えた。また裏面にビームプロファ イルをモニタするためのセラミック板を設置した。 コヒーレント放射を反射鏡で室外に輸送した。光輸 送路を短く変更し、この部分での光の吸収を少なく した。ビームスプリッターで分割した光をビームの 変動を補正するため利用した。回折格子の分解能は 1%で、電子バンチ間での光の干渉の影響は無視でき る。光源として利用するコヒーレント遷移放射の安 定性を測定した(図2)。ビーム条件はエネルギー: 20MeV、パルス幅:8ns、マルチバンチビーム繰り返 し:10 pps、測定条件は、波長 985 µm、積算回数 30 回で行った。光の強度の変動は±2.3%であった。光 源として利用するための、比較的安定なコヒーレン ト遷移放射が得られた。また、試料の厚さはスペー サーを挿入することによって調節し、試料の温度は シリコンラバーヒーターと冷窒素ガスを用いること により0℃から100℃まで調節できるホルダーを用い た。ホルダーの窓板の条件として、①遠赤外領域で の透過率が高い。②弾性率が大きく試料の厚みを-定に保てる。③試料と反応しない、などの条件を満 たす材料を用いる。今回の実験では、上の条件を満 たす、無水石英を窓板として用いた。検出器は液体 ヘリウム冷却シリコンボロメーターを用いた。この ように回折格子を用いて、比較的高い波長分解能で 直接水の吸収分光が行われたのは初めてである。

3.2 ミリ波分光によるイメージング測定系 の条件

測定配置を図3に示す。回折格子分光器を通した 光を絞って試料を透過させた。ビームスプリッター で分割した光をビームの変動を補正するため利用し た。コンピュータで制御できる X-Y 軸ステージ、ス テージコントローラーを用いて試料を移動させ、透 過光強度を検出器で測定してイメージングを行う。

4. 実験結果および考察

4.1 液体の吸収分光測定

波数領域 5-24 cm⁻¹で水、重水の吸収分光測定を行った。ホルダーとして使用している無水石英板の表面からの反射光による干渉の結果、透過光スペクトルに振動が認められる(図4)。水の温度を変化させると、温度の上昇にともない光の透過率の減少が 観測された(図5)。原因として水の温度上昇に伴い、1自由度あたりの運動エネルギーが増加することが考えられる^[6]。また、水、重水の試料に対する光の透過率から、Kramers-Kronigの関係式^[7]を用いて 解析を行い、屈折率、消衰係数を求めた。1996年の J.T.Kindt らの論文^[68,9]のデータとほぼ一致した結 果が得られた。ただし、この測定の際、検出器のノ イズが大きかったので、現在再度測定を行っている。





図3:イメージングのための測定配置の概念図

4.2 ミリ波分光によるイメージング測定

ミリ波分光によるイメージング測定の予備実験として、波数領域 5-24 cm⁻¹で試料がない時、銀杏の生 葉、電子レンジで水分を蒸発させた銀杏の葉(枯葉) で吸収分光測定を行って比較した(図6)。試料が ない時と枯葉との、光の透過率の波長依存性は、ほぼ 同じ傾向を示した。また、銀杏の生葉の透過高強度は、 水の透過高強度とほぼ同じ傾向を示すことから銀杏 の生葉による光の吸収は、主に水による吸収と考え ることができる。現在、生きた葉、枯葉などの試料を 異なる波数で測定し、イメージングを行っている。

5. 結言

マルチバンチビームからのコヒーレント遷移放射 を光源として、ミリ波・サブミリ波領域で水、重水 の吸収分光測定を行った。メタノール、エタノール、 葉などの試料について屈折率、消衰係数を求めた結 果について報告する。また、コヒーレント遷移放射 を光源として、ミリ波・サブミリ波領域で水、銀杏の 葉に対する光の透過率を求めて比較した。枯葉、その 他の試料についての透過光によるイメージングの結 果についても報告する。

参考文献

- T. Tkahashi, T. Matsuyama, K. Kobayashi, Y. Fujita, Y. Shibata, K. Ishi, and M. Ikezawa, Rev. Sci. Instr. 69 (1998) 3770.
- [2] S. Okuda, M. Nakamura, K. Yokoyama, R. Kato, T. Takahashi, Nucl. Instrum. Meth. A (in press).
- [3] S. Okuda, Y. Honda, N. Kimura, J. Ohkuma, T. Yamamoto, S. Suemine, T. Okada, S. Takeda, K. Tsumori and T. Hori, Nucl. Instrum. Meth. A358 (1995) 290.
 [4] H. Ohtake, S. Ono, M. Sakai, et al., Appl. Phys. Lett. 76
- [4] H. Ohtake, S. Oho, M. Sakai, et al., Appl. Phys. Lett. 76 (2000) 1398.
 [5] H. Sarukura, H. Ohtake, S. Izumida, et al., J. Appl. Phys.
- [6] M. N. Afsar and J. B. Hasted, J. Opt. Soc. Am. 67 (1977)
- [6] M. N. Afsar and J. B. Hasted, J. Opt. Soc. Am. 67 (1977) 90.
 [7] T. G. Goplen, D. G. Cameron, and R. N. Jones, Applied
- [7] T. G. Colleri, D. C. Cameron, and K. N. Jones, Applied Spectroscopy 34 (1980) 652.
 [8] J. T. Kindt and C. A. Schmuttenmaer, J. Phys. Chem. 100
- [6] V. J. Fillian et al. J. Mal. Lin. (8 (1006) 171
- [9] W. J. Élllison, et al., J. Mol. Liq. 68 (1996) 171.



